

Hyperion compact

Oberflächen berührungslos messen.

- ▶ Rauheit
- ▶ Kontur
- ▶ Topografie

→ OPM ←

Optische Präzisionsmesstechnik

See the difference!

Hyperion compact

Oberflächen berührungslos messen.

Das hochpräzise Oberflächenmessgerät für artefaktfreie Erfassung von Topografien und Profilen

Hardware

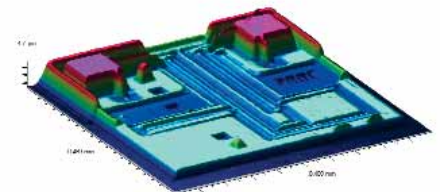
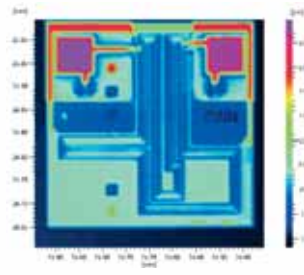
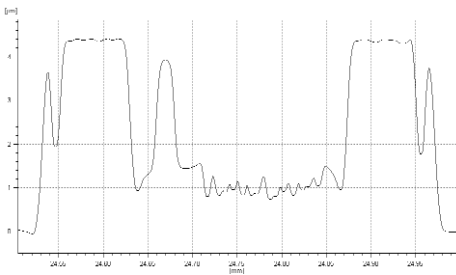
- ▶ Schwingungsstabile Granitbauweise
- ▶ Hochauflösendes Wegmesssystem
- ▶ Spielfreie Kugelumlaufspindeln
- ▶ Hohe Wiederholgenauigkeit
- ▶ Integrierte OPM Motorsteuerelektronik
- ▶ Geringer Platzbedarf

Features

- ▶ Flexibles Multisensor-System
- ▶ Positionierung per CCD Kamera
- ▶ Perfekte Positionierkontrolle
- ▶ Hohe Messgeschwindigkeit

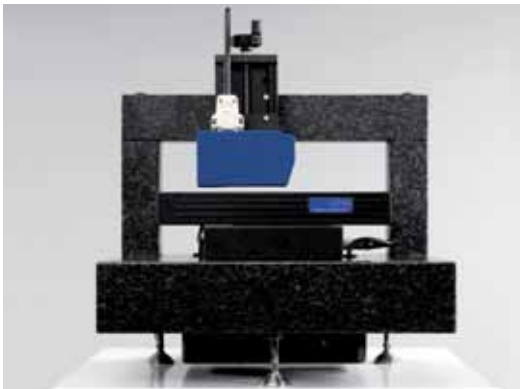
Software

- ▶ OPM Inspector Auswertesoftware
- ▶ Automatisierung von Messungen
- ▶ Umfangreiche Grafikdarstellungen
- ▶ DIN/ISO Berechnungen
- ▶ Windows® kompatibel



Technik

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Messbereich xy | 50 x 50 mm, bis 200 x 200 mm |
| Auflösung xy | 0.5 µm |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit | 50 mm/sec |
| Max. Probengewicht | 15 kg |
| CCD Kamera | Optional |
| Motorisch verstellbare z Achse | Optional |
| Schwingungs isoliertisch | Optional |









→ OPM ←

Optische Präzisionsmesstechnik

Hyperion compact

Für jede Aufgabe die richtige Sensortechnologie.

| | KF3  | KF3 Tele  | AF16  | C1  |
|----------------------|--|--|--|---|
| Messprinzip | Konfokalsensor | Konfokalsensor | Autofokussensor | Weißlichtsensor |
| Strahlquelle | Halbleiterlaser | Halbleiterlaser | Halbleiterlaser | Halogenlampe |
| Messfleckdurchmesser | <2 µm | 2 µm | 1.9 µm | 5 µm |
| Messbereich | 1000 µm | 1000 µm | 1500 µm | 300 µm |
| Arbeitsabstand | 4 mm | 13,5 mm | 2 mm | 4 mm |
| Auflösung | 20 nm | 20 nm | 10 nm | 25 nm |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - Kompakte Bauform - Einfachste Bedienung - Großer Dynamikbereich 5000:1, d. h. zuverlässige Messergebnisse ohne Parametereinstellungen - Universeller Sensor für eine Vielzahl von Applikationen | <ul style="list-style-type: none"> - Großer Arbeitsabstand bei hoher numerischer Apertur - Einfachste Bedienung - Großer Dynamikbereich 5000:1, d. h. zuverlässige Messergebnisse ohne Parametereinstellungen. - Universeller Sensor für eine Vielzahl von Applikationen | <ul style="list-style-type: none"> - Integriertes Mikroskop - Maßverkörperung durch hochwertigen Glasmaßstab - Keine Kalibrierung erforderlich | <ul style="list-style-type: none"> - Miniaturisierte Bauform - Einfache Integration in OEM-Systeme |
| Applikationen | <ul style="list-style-type: none"> - Messung von Ebenheit, Höhe und Position - Berechnung von Fläche, Dicke und Volumen - Automatisierte Messungen | <ul style="list-style-type: none"> - Messung von Ebenheit, Höhe und Position - Berechnung von Fläche, Dicke und Volumen - Automatisierte Messungen - Messungen unter industriellen Bedingungen und in schwer zugänglichen Bereichen | <ul style="list-style-type: none"> - Messung von Form, Ebenheit, Höhe und Position - Berechnung von Fläche, Dicke, Volumen und Rauheit | <ul style="list-style-type: none"> - Messung von Ebenheit, Höhe und Position - Präzise Abstandsmessungen - Hervorragend geeignet zur Integration in OEM Applikationen - Rauheitsmessungen |
| Anwendungsgebiete | <ul style="list-style-type: none"> - Mikrostrukturtechnik - Optische Industrie - Elektrotechnik, Elektronik, Packaging - Kunststoff- und Papierverarbeitung - Inspektionsaufgaben in der Halbleiter- und Leiterplattenfertigung | <ul style="list-style-type: none"> - Mikrostrukturtechnik - Optische Industrie - Elektrotechnik, Elektronik, Packaging - Kunststoff- und Papierverarbeitung - Inspektionsaufgaben in der Halbleiter- und Leiterplattenfertigung - Maschinenbau | <ul style="list-style-type: none"> - Dickschicht, Hybrid - Optische Industrie, Telekommunikation - Elektrotechnik, Elektronik, Packaging - Materialforschung, Tribologie - Maschinenbau | <ul style="list-style-type: none"> - Hochpräzise Abstandsmessungen - Mikrostrukturtechnik - Optische Industrie - Elektrotechnik, Elektronik, Packaging - Kunststoff- und Papierverarbeitung - Inspektionsaufgaben in der Halbleiter- und Leiterplattenfertigung |

OPM Leistungsübersicht

Entwicklung, Konstruktion und Fertigung

- > Lasersensoren und Weißlichtsensoren
- > Oberflächenmessgeräte
- > Kundenspezifische Sonderentwicklungen

Dienstleistung

- > Kooperation mit Kunden zur anwendungsorientierten Weiterentwicklung der Auswertesoftware OPM Inspector
- > Messung und Auswertung von Oberflächen
- > Service, Kalibrierung und Umrüstung von UBM-Messanlagen



Optische Präzisionsmesstechnik

OPM
Optische Präzisionsmesstechnik GmbH
Nobelstraße 7
76275 Ettlingen

Telefon +49(0)7243/529942
Telefax +49(0)7243/524480

info@opm-messtechnik.de
www.opm-messtechnik.de